## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年 5月 6日現在

機関番号:25301 研究種目:若手研究 研究期間:2009~2010 課題番号:21760263 研究課題名(和文)	(B) D 微細テフロン導波管回路の開発と集積化に関する研究		
研究課題名(英文)	Study on development of micro PTFE-waveguide circuit and its integration		
研究代表者			
岸原 充佳(KISHIHARA MITSUYOSHI)			
岡山県立大学・情報工学部・准教授			
研究者番号:50336905			

研究成果の概要(和文):本研究は,放射光によるテフロンの微細加工を行い,表面への金属の 蒸着を施すことでミリ波やそれ以上のサブミリ波領域の周波数で応用が可能な微細導波管回路 素子を構成する技術の開発を試みた.これにより,曲がりや不連続を集積した形状のアイリス 結合バンドパスフィルタおよび空気領域ポストを持つ十字形 3dB 方向性結合器を放射光直接エ ッチングと Au スパッタ・電解メッキで完成させ,本加工法の有用性を明らかにした.

研究成果の概要(英文): In this work, micro fabrication techniques for waveguide components suitable for millimeter-wave and submillimeter-wave applications have been developed. The PTFE microstructures are fabricated by direct exposure to synchrotron radiation, and the waveguiding structure is obtained by sputter deposition of metal on the PTFE surface. In this work, an iris-coupled bandpass filter and a cruciform coupler with air-filled posts inclusive of bends and discontinuities were designed and fabricated, and the validity of the present fabrication process was demonstrated.

## 交付決定額

(金額単位:円)

			(並領半位・口)
	直接経費	間接経費	合 計
2009 年度	2, 100, 000	630, 000	2, 730, 000
2010 年度	1, 000, 000	300, 000	1, 300, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 100, 000	930, 000	4, 030, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:電気電子工学 ・ 電子デバイス・電子機器 キーワード:ミリ波, 導波管, 放射光, 放射光エッチング, マイクロデバイス, スパッタ蒸着, 導波管フィルタ, 導波管カプラ

1.研究開始当初の背景 (1)種々の微細加工技術を活用して機械部 品や光スイッチの様なマイクロデバイスを 実現しようとする研究が盛んである.マイク ロ波ミリ波工学分野においても RF-MEMS 等に 代表されるように,微細加工技術を用いて回 路素子を実現する研究・開発が盛んに行われ ている.

主な微細加工技術としては, 放電加工, レ

ーザ加工,リソグラフィ,LIGA などが知られ ている.放電加工は,硬質の金属の加工に有 効な方法であるが,被加工物が導体でなけれ ばならない点で応用範囲が制限される.レー ザ加工は,非接触で加工でき精度が高いのが 特徴であるが,大量生産には向かないと言わ れている.リソグラフィには,紫外線の他, X線を用いるものもあり,加工精度はマスク 精度とレジストの性能に依存する.リソグラ フィは、半導体製作プロセスへの応用が一般 的である。LIGAは、X線リソグラフィ、電鋳、 鋳型法を組み合わせた方法で、マイクロパー ツなどの製作に応用されている.

マイクロ波・ミリ波分野での微細加工を扱 った報告例としては、J.W.Digby らによる W 帯(75-110GHz)の H 面導波管ホーンアンテナ や Forman によるコプレーナ線路とフィルタ の試作がある.前者は、フォトレジスト (SU-8)を使用した製作プロセスであるため, 導波管コンポーネントの厚みが最大で 700 μ mに制限されたものである.後者は,LIGAプ ロセスを応用したものであるが,厚み517μm となっている. 導波管の伝送電力は断面積に 比例するため,目標とする導波管構造は十分 な厚さが確保されたものでなければならな い.標準導波管(H面導波管として使用)では, 管幅の 1/2 程度の厚さが用いられるが,上記 の製作プロセスではミリ波帯導波管の厚さ を確保することは困難である. 十分な厚さを 確保した微細構造物を実現することが課題 となる.

(2) テフロン(PTFE)は、マイクロ波の基板や ケーブル、コネクタ類の誘電体材料や絶縁体 としても一般的に使用されているが、加工、 とりわけ数 10µm の精度で数 100µm の高さ をもつ構造体の微細機械加工が非常に困難 な材料としても知られている.しかし、放射 光を照射すれば、厚さ 1mm 以上のテフロンを 高アスペクト比で直接加工することが可能 である.

これまでに、本放射光直接エッチングを利 用してテフロンの加工を行えば、テフロンで 形成された導波路パターンを作成し得るこ とに着目し、これを導波路の核(媒体)として 周囲に金属を蒸着させることで、誘電体で満 たされた金属導波管が製作できることを実 証した(若手研究(B),課題番号18760258).図 1に示すような、Qバンド(33-50GHz)ミリ波 テフロン導波管の試作例を報告している.



図1 放射光によるミリ波テフロン導波管試作例

## 2. 研究の目的

本研究は、金属導波管を出発点として、ミリ波(30GHz~)もしくはそれ以上のサブミリ 波領域での応用が期待できる導波路および 素子を構成する技術の確立を目的に据え、放 射光直接エッチングによるテフロンの加工 と、テフロン表面への金属蒸着による導波管 構造の形成を試みている.

本研究では、これまでの研究成果を踏まえ、 曲がりや分岐、不連続パターンなどの製作プロセス確立と評価を終え、複数のH面導波管 回路を集積した形状を持つ機能回路を実現 することを目的とする.機能回路として、実 用的なアイリス結合バンドパスフィルタお よび空気領域ポストを持つ十字形 3dB 方向性 結合器の設計と試作を行い、良好な周波数特 性の得られることを確認している.

3. 研究の方法

(1) 本研究では、兵庫県立大学高度産業科学 技術研究所ニュースバル放射光施設に設置 されたビームライン"大面積 X 線露光システ ム BL-2"を使用して放射光直接エッチングを 実施した.ニュースバル放射光施設は、 1.5GeV の蓄積電子ビームリングを持ち、主に 産業応用技術の開発に利用されている.BL-2 は、多軸露光ステージが差動排気機構を介し て接続されており、2keV-12keV(highpass)と 2keV 以下(lowpass)のエネルギー帯域を任意 に選択できる.本研究では、highpass モード を使用している.

(2)本研究では、X線照射により直接テフロ ンパターンを形成するため、放射光エッチン グプロセスを導入する.手順は、以下のよう になる.まず、適当な寸法のテフロンシート を準備する.テフロンシートの厚さは製作す る導波管の高さとなるので、所望の厚さを準 備する必要がある.そして、導波路パターン を写したステンシルマスクを準備する.本研 究のマスクは、厚さ 100µm の SUS304 で製作 した(公差±7.5µm).このステンシルマスク が、回路形状とその精度を決定する.マスク の開口は、テフロンの不要部に対応して開け る必要がある.

放射光エッチングプロセスの実験概略図 を図2に示している.ステンシルマスクをテ



フロンシート上に置き, 露光チャンバー内の ステージに固定する. 図は, アイリス結合バ ンドパスフィルタの場合が示されている. ス テージにはヒーターが内蔵されており, テフ ロンシートの背面から加熱を行う. テフロン の加工レートが基板の温度に依存すること, および飛散したテフロンの再付着を防ぐ目 的でヒーターを使用する. その後, チャンバ ー内を真空に引き, 露光を行う. 露光中は, ステージをスキャンさせて, パターン全体が 逐次照射される. これにより, 導波路パター ンが得られる.

(3) 次は、金属のスパッタ蒸着と電解メッキ の工程に移る. 前節でエッチングしたテフロ ンパターンの全表面に Au をスパッタ蒸着す ることで,金属薄膜で覆われた導波管構造が 実現する(図 3(a)). まず前処理として,エ ッチングで得たテフロンパターンを洗浄す る.もし、テフロン片の残りが付着していれ ば、この段階で除去しておく. テフロンは撥 水性であるため、表面改質を行わなければ金 属膜の接着強度が得られない. そこで, Ar プ ラズマへの暴露を数分程度行うことでテフ ロン表面(側面を含む)を少し荒らして、その 後スパッタ蒸着法で Au の薄膜を形成するこ とにした. Ar プラズマへの暴露により生まれ るアンカー効果が接着力を大きくする.本研 究では、スパッタ蒸着で約 500nm の Au 膜を 形成した.図3(b)は、スパッタ蒸着後のテフ ロンパターンの写真である.写真では、右側 の固定テープを剥がされており、スパッタ前 のテフロンとの対比ができる.スパッタ蒸着 は、テフロンシートの表と裏の両側を行う. 側面やスリットについては、本方法で自然に 蒸着される.

金属膜は、電磁界が漏洩しないよう表皮深 さを考慮した厚さでなければならない.この 目的のため、電解メッキを行って、Au 膜を約 10µm まで堆積させた.Q 帯の表皮深さは約 0.4µm であるので、十分な膜厚が確保されて おり、導波管として十分動作すると考えられ





図3 スパッタ蒸着(a)テフロンパターンへのAu蒸着 (b)スパッタ蒸着後の写真

る. 最後に,パターンの不要な枠を除去すれば,テフロン導波管回路が完成する.

4. 研究成果

(1) まず、5 段チェビシェフ応答を持つQ帯 アイリス結合テフロン導波管バンドパスフ ィルタ(BPF)の試作を行い、本製作プロセス が細いスリットパターンを含む実用回路に 対しても有効であることを確認した.

① 図4に、5段チェビシェフ応答を持つアイ リス結合テフロン導波管 BPFの形状を示して いる. 幅  $d_i$ で厚さ tの誘導性窓(アイリス)が 間隔  $L_i$  (約 1/2)で並んでいる. 窓と窓に挟 まれた各区間は、空洞共振器を構成している. 導波管の内部は、比誘電率 $\varepsilon_r$ の誘電体材料で 満たされている.本 BPFの設計は、共振器直 結型フィルタの設計理論に基づいて行える. 動作帯域としてQ帯を選択したときのテフロ ン導波管の寸法は、 $\varepsilon_r=2.04$ に対して a=4.0mm, b=1.0mm となる.このときの TE<sub>10</sub>および TE<sub>20</sub> モードの遮断周波数は、それぞれ 26.2GHz と 52.5GHz であり、Q 帯標準導波管のものとほ ぼ一致している.高さ bの1.0mm は、エッチ ングレートを考慮して決定している.



図4 アイリス結合テフロン導波管 BPF の形状

上記寸法に基づき、5 段チェビシェフ応答 を持つアイリス結合テフロン導波管 BPF の設 計を行った.設計では、中心周波数  $f_0$ =42.0 GHz,通過帯域リップル 0.01 dB,通過帯域 下限および上限周波数  $f_1$ =41.8 GHz,  $f_2$ =42.2 GHz,帯域外 41.3 GHz での減衰 50 dB を仮定 する.これらの仕様を満足するフィルタ寸法 をアイリス板厚 t=0.2 mm として計算した. 設計には、アイリス窓のリアクタンス値が必 要となるが、本研究では電磁界シミュレータ HFSS を使用して求めた.結果として、  $L_1=L_5=2.909$  mm,  $L_2=L_4=3.106$  mm,  $d_3=d_4=0.727$  mm を得た.

② 前述の製作プロセスに基づいて、図4の5 段チェビシェフ応答を持つアイリス結合テ フロン導波管 BPF を試作した.放射光直接エ ッチングにより得られたフィルタのテフロ



図5 放射光直接エッチングにより得られたフィルタの テフロンパターン

ンパターンを図5に示す. 露光の際, 真空チ ャンバー内の基板温度は約220°Cに保った. 照射されたX線量は3600 A\*sec である. ニュ ースバルは平均220mAの蓄積電流値で運転さ れていることから, 図5のテフロンパターン を得るのには約4.5時間必要であった. 写真 より, フィルタパターンが直接エッチングで きていることが確認できる.

図6は、スパッタ蒸着と電解メッキにより Au 膜を形成したテフロンパターンの写真を 示している. Au 膜は、セロハンテープの粘着 力程度には十分耐え得る接着力を有してお り、通常の扱いで剥離しないことを確認して いる. この後、周囲の不要な枠を除去すれば、 テフロン導波管 BPF が完成する.





図 6 スパッタ蒸着,電解メッキにより Au 膜でコーティングされたフィルタパターン(a)全体写真(b)アイリス部分拡大写真

③ テフロン導波管 BPF の Sパラメータの周 波数特性をネットワークアナライザ (Agilent E8361C)で測定した. 図7にテフロ ン導波管 BPF の測定結果を示す. 測定結果に は、2個のQ帯標準導波管への変換器特性が 含まれる. 変換器を含むフィルタの周波数特 性を HFSS で計算し、併せて図7に示してい る. 中心周波数が高周波数側に約 180MHz (42GHz に対して 0.4%)ずれて、 $S_{21}$ に約 3dB の挿入損が見られるが、測定結果は設計 結果と一致していることが確認できる.

測定結果に約3dBの挿入損があるが、変換



図7 アイリス結合テフロン導波管 BPF の Sパラメータ 測定結果



図 8 フィルタ寸法を 0.5%縮小(平均 15µm)した場合の 計算結果と測定結果の比較

器の無い形状で導体損( $\sigma$ =4.1×107 S/m)およ び誘電体損( $\tan\delta$ =0.0002)を考慮して計算す ると、 $S_{21}$ は2.04dB(無負荷 Q:346)となる.2 つの変換器の thru 接続(back-to-back)状態 を測定すると、1.2 から 2dB の挿入損のある ことが確認できる.これらのことから判断し て、フィルタ自身(全長 36mm で直線部分を含 む)の挿入損は約 2dB であり、これは理論値 とほぼ同等であることが分かる.

周波数のずれは、共振器長が 0.5%から 1% 短くなることに相当している.これは、ステ ンシルマスクの製作精度、もしくは露光時の テフロン熱膨張(200°C で約 2%)によって説 明し得る範囲である.図8は、フィルタ寸法 を 0.5%縮小(平均 15µm)した場合の計算結果 と測定結果を比較したものである.これより、 両結果の通過帯域がほぼ一致することが確 認できる.

(2) 次に,空気領域ポストを持つ十字形 3dB 方向性結合器の設計と試作を行った.これは, 誘電体充填導波管の一部をくり抜いた空気 領域ポストを用いる構造で4ポート回路の方 向性と整合を制御したものである.十字交差 に誘電率の異なる不連続領域が一体化され た形状を有している.誘電体の一部をくり抜 くこの構造は,特に,放射光によるテフロン 微細加工プロセスに適している.

① 図 9 に、空気領域ポストを用いたテフロ



図9 空気領域ポストを持つ十字形方向性結合器の形状

ン導波管十字形方向性結合器の形状を示す. テフロン導波管は、内部を比誘電率 2.04 の テフロンで充填した構造であるが、テフロン の一部を円形にくり抜くことで空気領域を 作り、それを誘電率の異なる円形ポストとし て利用する回路構造である.本形状は,入出 カポートが直交し,対角線上に半径 r の空気 領域ポストが2本装荷され,各入出力ポート に半径 r.,の整合用空気領域ポストが1本ず つ装荷されている.Q帯を動作帯域とする導 波管寸法(4 mm×1 mm)を仮定し,平面回路 法を用いて 42 GHz で空気領域ポストの径(r, rm) と位置(*c*, *u*, *v*) を最適化設計して得た 結果を図10に示す.比帯域幅は10.5%である. 設計結果は, HFSS の計算結果と良く一致して いる.



図10 空気領域ポストを持つ十字形 3dB 方向性結合器 の設計結果. Sパラメータの周波数特性

② 放射光直接エッチングによるテフロンパ ターンの加工と、テフロン表面への Au の蒸 着・電解メッキにより本十字形方向性結合器 を試作した.結果として、図 11 に示される ようなテフロンパターンを得た.露光過程に おいて、真空チャンバー内の基板温度は 220°Cに保った.照射された X 線量は 6000



図 11 放射光直接エッチングにより得られた十字形方 向性結合器のテフロンパターン

A\*sec である. 図 11 のテフロンパターンを得 るために, 平均蓄積電流値 220mA に対し約 6.5 時間必要であった. 貫通空気領域を持つパタ ーンが正しくエッチングされていることが 分かる.

テフロンシートのエッチングを行った後 は、金属のスパッタ蒸着と電界メッキの手順 になる.空気領域ポストを形成するためには、 穴の上下面を導体で覆う必要がある.今回, 穴の上下面は、図 12(a)に示すように真空蒸 着に耐え得るポリイミドテープを貼り、その 上から直接蒸着とメッキを行った.図 12(b) に完成した十字形方向性結合器を示す.





(b) 図 12 スパッタ蒸着,電解メッキ(a)Au 蒸着前に行う 空気領域へのマスク(b)完成した十字形方向性結合器

③ 空気領域ポストを持つテフロン導波十字 形 3dB 方向性結合器のSパラメータの周波数 特性をネットワークアナライザで測定した. 図 13 に測定結果を示す.測定結果には、4 個 のQ帯標準導波管変換器の特性が含まれる.  $S_{31} と S_{41}$ の間に約 0.7dB の分配差が見られる が、測定結果は設計結果と良く一致している. 空気領域のマスキングに利用したポリイミ ドフィルム(厚 69µm)が分配差の原因と考え られる.変換器の挿入損が 1.2dB~2.0dB あ ることから、分配  $S_{31}, S_{41}$ に見られる約 1dB の挿入損を説明できる.また、出力位相差 もほぼ 90 度になっていることが分かる.従 って、設計結果の妥当性が実験的に確認で



図 13 空気領域ポストを持つ十字形 3dB 方向性結合器の測定結果. Sパラメータの周波数特性

きたと考える.

(3) 本研究課題の特色は、露光によるレジス トや PMMA シートの変質, エッチング溶液に よる不要分の除去という一般的な微細加工 プロセスを用いずに, 高分子材料 PTFE(テフ ロン)を放射光で直接加工するプロセスとな るところにある.即ち、マイクロ波・ミリ波 の導波路材料のひとつとして広く用いられ ているテフロンで, 微細導波管構造および各 種回路素子を直接実現するところに本研究 の独自性がある.回路の厚みも1mm以上に対 応できる.現在のところ、本研究以外に放射 光直接エッチングを高周波導波路の作製へ 応用した例は報告されていない. 波長 160nm の真空紫外レーザを用いてテフロンの加工 を行うことは可能であるが,加工レートが遅 いために低アスペクト比な加工が可能とな るのみである. 高アスペクト比な構造物を形 成するには非現実的と考えられる.

本研究課題により,H 面導波管系の機能 回路製作プロセスを確立することができた と考えるが,今後の展望として,短波長化 とE面導波管回路系の機能回路の実現と集積 化を試みることが目標となる.これらは,本 課題期間中にも継続的に試みられたが,最大 露光時間の制約やマスク固定精度の問題か ら,現在のところ完成するに至っていない.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計2件)

 <u>岸原充佳</u>,太田勲,河合正,大久保 賢祐,誘電体ポストを用いたH面導波管 十字交差形方向性結合器の設計,電子情 報通信学会論文誌(C),vol. J94-C, no. 7, 2011,掲載決定,査読有.

② <u>岸原 充佳</u>,池内 裕章,村井 克弥, <u>内</u>

<u>海 裕一</u>,河合 正,太田 勲,放射光直 接エッチングによるテフロン導波管BPF の試作と評価,電子情報通信学会技術研 究報告,vol.110,MW2010-19,pp.29-33, 2010,査読無.

〔学会発表〕(計6件)

- M. Kishihara, H. Ikeuchi, K. Murai, T. Azeta, <u>Y. Utsumi</u>, T. Kawai, and I. Ohta, Design and Fabrication of PTFE-Filled Waveguide Cruciform Coupler with Air-Filled Posts, 2011 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, THPL-2, June 9, 2011, Baltimore, USA, 採択済.
- <u>岸原 充佳</u>,池内 裕章,村井 克弥,畔 田 吏,<u>内海 裕一</u>,河合 正,太田 勲, 空気領域ポストを用いたテフロン導波管 十字ハイブリッドの試作,2010年電子情 報通信学会ソサイエティ大会,C-2-43, p.79, Sept. 16,2010,大阪府立大学.
- ③ <u>M. Kishihara</u>, M. Kato, H. Ikeuchi, K. Murai, Y. Ukita, <u>Y. Utsumi</u>, T. Kawai, I. Ohta, Fabrication of PTFE-Filled Waveguide Bandpass Filter Using SR Direct Etching, 2010 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, pp. 1724-1727, THPQ-3, May 27, 2010, Anaheim, USA.
- ④ <u>岸原 充佳</u>,加藤 宗彦,池内 裕章,村 井 克弥,浮田 芳昭,<u>内海 裕一</u>,河合 正,太田 勲,放射光エッチングによる テフロン導波管BPFの試作,2010 年電子 情報通信学会総合大会,C-2-74, p.117, Mar. 17,2010,東北大学.
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者
   岸原 充佳(KISHIHARA MITSUYOSHI)
   岡山県立大学・情報工学部・准教授
   研究者番号: 50336905

(2)連携研究者

内海 裕一(UTSUMI YUICHI)
 兵庫県立大学・高度産業科学技術研究所・
 准教授
 研究者番号:80326298